

**دانشگاه شهید چمران اهواز**  
**معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی**  
**طرح درس ویژه درس‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه**

**افزاده‌های نیمه‌رسانا**

**عبدالنبی کوثریان**

نام و نام خانوادگی استاد: عبدالنبی کوثریان	مرتبه علمی: استاد	آدرس ایمیل: a.kosarian@scu.ac.ir
دانشکده: مهندسی	گروه: برق	نیمسال تحصیلی: دوم ۹۸-۹۹
دوره تحصیلی: کارشناسی ارشد و دکترا	نام درس: افزارهای نیمه‌رسانا	تعداد واحد: ۳

### جایگاه درس در برنامه درسی دوره:

این درس یکی از دروس اساسی کارشناسی ارشد و دکترای گرایش الکترونیک است که با فراگیری آن دانشجو می‌تواند اطلاعات لازم برای شناخت فرآیندهای اساسی حاکم بر عملکرد افزارهای نیمه‌رسانا و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار افزارهای نیمه‌رسانا را کسب کند.

### هدف کلی:

هدف این درس کسب شناخت عمیق از ساختار و رفتار افزارهای نیمه‌رسانا است.

### اهداف یادگیری:

در این درس دانشجو با موضوعات زیر آشنا می‌شود که برای شناخت فرآیندهای حاکم بر رفتار افزارهای نیمه‌رسانا اهمیت بسیار زیادی دارد.  
مرور فیزیک نیمه‌رسانا

فراپیوندهای **(P-N HETEROSTRUCTURES) P-N**

پیوندهای تونلی و مکلیسم تونل‌زنی

بررسی دقیق پیوندهای شاکلی در قالب مدل‌های **TE, FE, TFE**

افزارهای مبتنی بر خازن **MOS**

بررسی **MOSFET**

مباحث پیشرفته در افزارهای **BJT**

بررسی ترانزیستورهای **HBT**

افزارهای پیشرفته **MODFET MESFET JFET**

افزارهای فرکانس بالا مانند افزارهای تونل‌زنی و **IMPATT**

افزارهای با ساختار کوانتومی

افزارهای نوری

### رفتار ورودی:

دانشجو باید پیشینه قوی از شناخت مفاهیم اساسی، فرآیندهای حاکم و اصول رفتار و عملکرد الکترونیکی افزاره-های نیمه‌رسانا را داشته باشد.

### مواد و امکانات آموزشی:

ارائه این درس نیازمند ویدئو پروژکتور، اینترنت، وایت بورد و سایر امکانات متداول تدریس می‌باشد.

### روش تدریس:

به دلیل این که این درس یکی از دروس اساسی گرایش الکترونیک در زمینه افزاره‌های نیمه‌رسانا می‌باشد، در کنار تدریس کلاسیک درس، مواردی نیز برای تحقیق و تفحص دانشجویان و تعمیق بیشتر موضوع به دانشجویان محول می‌شود که باید به صورت گزارش ارائه گردد.

### وظایف دانشجو:

- ۱- حضور به موقع و مداوم در کلاس درس داشته باشد.
- ۲- در بحث‌های کلاسی مشارکت فعال داشته باشد.
- ۳- به طور مستمر با مرور مطالب درسی خود را به روزرسانی کند.
- ۴- تکالیف درسی و پژوهش‌هایی که توسط استاد درس ارائه می‌شود را به موقع انجام دهد.

### شیوه آزمون و ارزیابی:

ارزیابی این درس بر اساس موارد زیر خواهد بود:

- حضور و مشارکت فعال در مباحث درسی
- انجام تکالیف و حل تمرین‌های درسی محوله و انجام تحقیق‌های کلاسی
- آزمون‌های درون کلاسی
- آزمون‌های نهایی

منابع درس:

- 1- S. M. SZE AND K. K. NG, PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES, 3<sup>RD</sup> ED., WILEY, 2007.
- ۲- فیزیک ادوات نیمه‌هادی (ترجمه کتاب ردیف ۱)، عبدالنبی کوثریان، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۱
- 3- Y. TAUR AND T. H. NING, FUNDAMENTALS OF MODERN VLSI DEVICES, 2<sup>ND</sup> ED., CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009.
- 4- S. M. SZE AND M. K. LEE, SEMICONDUCTOR DEVICES: PHYSICS AND TECHNOLOGY, 3<sup>RD</sup> ED., WILEY, 2013.

هفته یکم  
(۹۸/۶/۲۹ تا ۹۸/۶/۲۳)

مرور فیزیک نیمه‌رسانا

انواع پیوندها در افزاره‌های نیمه‌رسانا:

پیوند P-N، پیوند فلز-نیمه‌رسانا، پیوند نیمه‌رسانا-عایق، فرایپیوند، پیوند فلز-عایق

**بررسی پیوند P-N**

چگالی بار فضا

حل معادله پواسن

هفته دوم  
(۹۸/۷/۵ تا ۹۸/۶/۳۰)

توزیع میدان

توزیع پتانسیل

طول مشخصه- شعاع دیبای

مدل در بفت-دیفیوژن

مشخصه‌های جریان-ولتاژ: حالت ایده‌آل (رابطه شاگلی)

محاسبه چگالی جریان پیوند

خازن پیوند

حالت‌های خاص

عوامل انحراف از حالت ایده‌آل

پیوند شیبدار

پروفیل تزریق دلخواه

فرآیند باز ترکیب

هفته سوم  
(۹۸/۷/۱۲ تا ۹۸/۷/۶)

ترانزیستور دو قطبی

بایاس ترانزیستور

مود فعال مستقیم

مود اشباع

مود قطع

مود فعال معکوس

غلظت حاملها در امیتر، بیس، و کلکتور

مؤلفه‌های جریان و گین جریان

هفته چهارم  
(۹۸/۷/۱۹ تا ۹۸/۷/۱۳)

اثرات غیرایده‌آلی  
باریک شدگی گاف امیتر  
اثر کرک  
تجمع جریان



هفته پنجم  
(۹۸/۷/۲۶ تا ۹۸/۷۶/۲۰)

ترانزیستور دوقطبی فرایبوندی (HBT)

محاسبه مؤلفه‌های جریان HBT

مزایای HBT

ترانزیستور دوقطبی با بیس شیپدار

ترانزیستور الکترون داغ

هفته ششم  
(۹۸/۸/۳ تا ۹۸/۷/۲۷)

اتصال فلز-نیمه‌رسانا

تشکیل سد

لایه تخلیه

حالت‌های فصل مشترک

تاثیر تشکیل سیلیساید

کاهندگی نیروی تصویری

تنظیم ارتفاع سد

هفته هفتم  
(۹۸/۶/۱۰ تا ۹۸/۸/۴)

فرآیندهای ترابری جریان

نظریه گسیل گرمایونی

نظریه دیفیوژن

هفته هشتم  
(۹۸/۸/۱۷ تا ۹۸/۸/۱۱)

نظریه گسیل گرمایونی - دیفیوژن

جریان تونلی

تزریق حاملهای اقلیت

هفته نهم  
(۹۸/۸/۲۴ تا ۹۸/۸/۱۸)

اندازه گیری ارتفاع سد  
اندازه گیری جریان ولتاژ  
اندازه گیری انرژی فعال سازی

هفته دهم  
(۹۸/۹/۱ تا ۹۸/۸/۲۵)

اندازه گیری ظرفیت ولتاژ  
اندازه گیری فنوالکتریکی  
ساختارهای افزارهای  
اتصال اهمی

هفته یازدهم  
(۹۸/۹/۸ تا ۹۸/۹/۲)

خازن فلز-اکسید-نیمه‌رسانا

رژیم انباشت

رژیم نوار تخت

رژیم تخلیه

رژیم وارونگی

رژیم وارونگی شدید

غلظت سطحی

محاسبه میدان و پتانسیل

رابطه ولتاژ گیت و پتانسیل سطحی

محاسبه ولتاژ آستانه گیت

هفته دوازدهم  
(۹۸/۹/۱۵ تا ۹۸/۹/۹)

ترانزیستور اثر میدان فلز-اکسید-نیمه رسانا (MOSFET)

تقریب کانال شییدار و مدل کنترل بار

رژیم بالای آستانه

محاسبه چگالی بار سطحی بر حسب ولتاژ و مکان

محاسبه چگالی الکترون های آزاد بر حسب ولتاژ و مکان



هفته سیزدهم  
(۹۸/۹/۲۲ تا ۹۸/۹/۱۶)

محاسبه بار تخلیه در طول کانال

محاسبه توزیع میدان الکتریکی در زیر گیت در طول کانال

محاسبه جریان اشباع درین-سورس

رژیم تحرک

رابطه سرعت-میدان غیرخطی

تجزیه و تحلیل جریان اشباع در رژیم پرتابی

تأثیر بایاس زمینه بر ولتاژ آستانه

هفته چهاردهم  
(۹۸/۹/۲۹ تا ۹۸/۹/۲۳)

ناحیه زیرآستانه

سوینگ زیرآستانه

تزریق غیریکنواخت و افزاره کانال مدفون

**HIGH-LOW** پروفیل

**LOW-HIGH** پروفیل

هفته یازدهم  
(۹۸/۹/۳۰ تا ۹۸/۱۰/۶)

## افزارهای مایکروویو

ادوات الکترون انتقالی و انتقال در فضای واقعی

دیود الکترون انتقالی (TED)

ساختار

اثر الکترون انتقالی

مشخصه‌ها

تشکیل حوزه

مودهای عملکرد

کاربردها

دیود RST

ساختار

مشخصه‌ها

پدیده انتقال در فضای واقعی

توصیف منشأ مقومت منفی در دیود RST

دیود IMPATT

ساختار

مشخصه‌ها

مکانیسم IMPATT

محاسبه جریان

ساختار دو-دریفتی

کاربردها

دیود TRAPATT

دیود DOVATT

دیود MITATT

دیود BARITT

دیود TUNNETT

هفته شانزدهم  
(۹۸/۱۰/۱۳ تا ۹۸/۱۰/۷)

ساختار سلول خورشیدی  
سلول خورشیدی سیلیکن کریستالی  
سلول خورشیدی سد شاتکی و **MIS**  
سلول خورشیدی چند پیوندی  
سلول خورشیدی سیلیکن آمورف